JCSS校正サービス

国内トップクラスの校正測定能力を誇る ミツトヨのJCSS校正サービス











JCSS(計量法校正事業者登録制度)

ミットヨは、ISO/IEC17025 に基づく国際MRA対応JCSS認定事業者としての認定を取得しております。 幅広いミットヨ製品に対し、メーカーとして培った校正ノウハウで国内トップクラスの校正測定能力を誇る JCSS校正サービスをご提供します。

JCSS校正サービスのメリット

- 校正事業者の技術能力の証明
- 国家計量標準へのトレーサビリティ
- トレーサビリティ確保に必要な不確かさの証明
- 国際的に通用する校正証明書の発行 (国際MRA対応)

■JCSSとは

JCSSとは、Japan Calibration Service System の略称であり、計量法に基づく計量法トレーサビリティ制度を表しています。

NITE IAJapan (独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター) による審査を経て登録が認められた事業者は、 JCSS認定ロゴマーク付きの校正証明書を発行することができます。

JCSS認定ロゴマーク付き校正証明書は、日本の国家標準へのトレーサビリティが確保され、また確かな技術力に裏打ちされた信頼できる事業者によって校正されたことを簡潔かつ明確に証明するものです。

■国際MRA対応JCSS認定事業者

JCSSを運営している認定機関であるNITE IAJapanは、国際試験所認定協力機構(ILAC)およびアジア太平洋認定協力機構(APAC)の相互承認(MRA)協定に署名しています。

そのため、国際MRA対応JCSS認定事業者によって発行されるILAC-MRA付きJCSS認定シンボルの入った校正証明書は、ILAC・APACを通じて国際MRAに署名している国または経済地域で有効となります。



国際MRA対応認定証(見本)



JCSS校正証明書(見本)



JCSS校正結果(見本)

ISO/IEC 17025 認定取得品目

ISO/IEC 17025の認定を取得している以下の品目に対して、JCSS校正サービスのご提供が可能です。

校正手法の 区分の呼称	種類	校正対象/商品	校正範囲	拡張不確かさ ^{注1} (信頼の L=呼び寸法(r		
波長計量器	633 nm領域の波長 / 532 n	m領域の波長		1.4×10 ⁻¹³		
	ブロックゲージ		0.1 mm以上 100 mm以下	0.020 μm		
	(光波干渉測定)	ゲージブロック	100 mm超 250 mm以下	(0.010+0.00010 · L) μm		
	(儿双 1 / 沙冽足)		250 mm超 1000 mm以下	(0.010+0.00012 · L) µm		
	ブロックゲージ	/° ×°→ /	0.1 mm以上 100 mm以下	0.06 μm		
	(比較測定)	ゲージブロック	100 mm超 1000 mm以下	(0.04+0.00043 • <i>L</i>) µm		
	(20)30/0/2	チェックマスタ	TOO HIME TOOS HIMPSY T	(εισ το εισ εισ εισ εισ μιπ		
	各種長さ測定用校正器で 測定面が平面であるもの (光波干渉測定)	キャリパチェッカ	2100 mm以下	(0.18+0.38 • L/1000) μm		
		内側マイクロチェッカ				
		段差マスタ	1 mm以下	0.030 um	0.030 rim	
				0.030 µm	•	
		段差ブロック	1 mm以下	0.030 µm		
		段差標準片	1 mm以下	0.030 μm		
	各種長さ測定用校正器で 測定面が平面であるもの (比較測定)	デプスマイクロチェッカ	0.5 mm以上 300 mm以下	(0.5 . 1 /1.000)		
		ハイトマスタ	1060 mm以下			
		円筒端面ゲージ	25 mm以上 500 mm以下	(0.5+L/1000) μm		
		段差ゲージ	0.5 mm 以上 1060 mm 以下			
		マイクロメータ基準棒	25 mm以上 1000 mm以下	(0.4+L/1000) μm		
		マイプログータ歴学件		(0.4+2/1000) μm (0.10+0.12 • L/1000) μm		
	標準尺	標準尺	350 mm以下			
			350 mm超 1000 mm以下	(0.06+0.25 • L/1000) μm		
		基準スケール	1000 mm 以下	(0.15 + 0.33 • L / 1000) μm		
一次元寸法測定器		校正用チャート	パターンサイズ: 0.2~0.4 mm	0.11 μm		
			1.75 mm以上 80 mm以下	0.7 µm		
			80 mm超 140 mm以下	0.8 µm		
		セットリング	140 mm超 200 mm以下	1.0 µm		
			200 mm超 250 mm以下	1.0 µm		
			250 mm超 300 mm以下	1.3 µm		
		キャリブレーションテスタ	5 mm以下	0.2 µm		
	ダイヤルゲージ校正器		25 mm以下	0.4 µm		
		インジケータ検査機	100 mm以下	(0.1+1.2 • L/1000) μm		
		外側マイクロメータ	500 mm以下	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		歯厚マイクロメータ	300 mm以下	(1.2+ <i>L</i> /175) μm		
	マイクロメータ	マイクロメータヘッド	25 mm以下	0.4 μm		
		マイクロメータハット 棒形内側マイクロメータ		0.4 µm		
		性ルグロアーダ	500 mm以下	$(3.5 + L / 150) \mu m$		
	指示マイクロメータ		マイクロメータ部: 100 mm以下	(0.7 + L / 250) μm		
			インジケータ部: ± 0.06 mm	(0.3 + L / 180) μm		
	ノギス		600 mm以下	0.02 mm		
	7 1 7		600 mm超 1000 mm以下	0.03 mm		
	ハイトゲージ		600 mm以下	0.015 mm		
	7/4 F7-9		600 mm超 1000 mm以下	0.020 mm		
	→ → / ° ~ °		600 mm以下	0.02 mm		
	デプスゲージ		600 mm超 1000 mm以下	0.03 mm		
			5 mm以下(目量0.001 mmおよび0.002 mm)	0.6 μm		
			10 mm以下(目量0.01 mm)	0.9 μm		
	ダイヤルゲージ		10 mm超50 mm以下(目量0.01 mm)	1.5 µm		
			50 mm超100 mm以下(目量0.01 mm)	2.2 µm		
		======================================	50.8 mm以下	0.8 µm		
		デジマチックインジケータ	50.8 mm超 100 mm以下	1.2 µm		
			0.6 mm以下(目量0.001 mmおよび0.002 mm)	0.5 μm		
	てこ式ダイヤルゲージ	テストインジケータ	1.6 mm以下(目量0.01 mm)	1.0 µm		
	シリンダゲージ		6 mm以上 400 mm 以下	0.5 μm		
	23251 2					
	電気マイクロメータ 球(平均直径)	ミューチェッカ	± 5 μm	0.15 μm		
			± 200 μm	0.2 µm		
			± 2000 μm	1.0 µm		
		マスターボール	10 mm以上 17 mm未満	(0.024 + 2.6 · L/1000) μm (0.06 + 0.4 · L/1000) μm		
		マ ヘラーホール	17 mm以上 45 mm以下			
	座標測定機	三次元測定機	250 mm以下	$(0.1 + 0.6 \cdot L/1000) \mu m$		
			1000 mm以下	$(0.2 + 0.2 \cdot L/1000) \mu m$		
			10000 mm以下	(0.1 + 0.6 · L/1000) μm		
			650 mm以下			
		画像測定機		(0.13 + 0.11 • L/1000) µm		
形状測定器			1000 mm以下	(0.22 + 0.23 • L/1000) μm		
	表面性状	粗さ標準片 (校正用表面性状標準片)	深さ	$2 \times \sqrt{6.70^2 + (2.74 \times d)^2}$ nm		
			0.3 μm以上 20 μm以下	d=深さ(μm)		
			・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			
			71113 T 31EC	2×√6.82 ² +(2.74×Ra) ² nm		
			0.1 μm以上 5 μm以下	Ra = 算術平均粗さ(µm)		
			最大高さ粗さ	$2 \times \sqrt{35.8^2 + (2.74 \times Rz)^2}$ nm	1	
			0.3 µm以上 20 µm以下	Rz = 最大高さ粗さ(µm)		
		表面粗さ測定機		0.02 µm		
		衣囲相さ測定機 (触針式表面粗さ測定機)	21.10			
				0.15 μm		
拉勒式油度計	抵抗温度計 (比較校正法)		4線式白金抵抗 温度計 (100 Ω) ^{注2} 0 ℃以上40 ℃以下	6 mk		
接触式温度計	也不計學什治帝型 (比於林	(正注)		8 mk		
	指示計器付温度計(比較校正法)		0℃以上40℃以下			
校正手法の 区分の呼称 ロックウェル 硬さ試験機等	種類 ロックウェル硬さ標準片 ロックウェル硬さ試験機		14-T-MC	拡張不確かさ ^{注1} (信頼の)水準約95%)	
			校正範囲	枯力的状況 水仁 2 松工	IB!###	
				恒久的施設で行う校正	現地校正	
			20 HRC以上 25 HRC以下	0.43 HRC	_	
			25 HRC超 35 HRC未満	0.44 HRC	-	
			35 HRC以上 45 HRC以下	0.42 HRC	_	
			45 HRC超 55 HRC未満	0.39 HRC	-	
			55 HRC以上 65 HRC以下	0.35 HRC	_	
			20 HRC以上 25 HRC以下		.45 HRC	
			25 HRC超 35 HRC未満	0	.46 HRC	
			35 HRC以上 45 HRC以下		.44 HRC	
			45 HRC超 55 HRC未満		.41 HRC	
			EE LIDCIVIT CE LIDCIVIT		27 LIDC	
			55 HRC以上 65 HRC以下	_ 0	.37 HRC	
					.37 HKC	
	ビッカース硬さ標準片		85 HV以上1050 HV以下	d > 193 μm 2.2%		
ピッカース	ビッカース硬さ標準片				%	
ビッカース 硬さ試験機等	ビッカース硬さ標準片		85 HV以上1050 HV以下 (試験力0.9807 N以上490.3 N以下)	d > 193 µm 2.2% d ≦ 193 µm (228/d)+1.02 9 くぼみ対角線長さ(ただし、	%	
	ビッカース硬さ標準片ビッカース硬さ試験機		85 HV以上1050 HV以下	d > 193 μ m 2.2% d \leq 193 μ m (228/ d)+1.02 9	% 式中の <i>d</i> はµi	

注1:登録事業者の技術能力の範囲で実現できる最小の不確かさであり、校正証明書に記載する不確かさとは異なる場合があります。

2024年7月現在

2

1

注2:抵抗値(R(T 90))の温度換算値です

JCSS校正対象製品

※JCSS校正対象外のモデルもございます。最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

ゲージブロック



校正機器



測定工具



硬さ試験機





画像測定機



表面粗さ測定機



表面粗さ測定機の主な対象機種

SV-2100 (Surfpak-EZ V3以上) SV-3200 SV-C3200 SV-C4500 SV-3000CNC SV-M3000CNC SV-C4500CNC

CS-3200 CS-3300

CS-(H)5000CNC (Formtracepak V4以上)

FTAシリーズ(Formtracer AVANT)

株式会社ミツトヨ

川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533 https://www.mitutoyo.co.jp



最寄りの営業所をご確認いただけます。 https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/japan/#sale

当社商品は外国為替および外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。 商品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業所へご相談ください。

- ●当社商品は製造現場での使用を前提とした、工業用商品として設計、製造、販売されています。
- ●本カタログで使用される当社商品名、サービス名およびロゴマークは、日本およびその他の国における株式会社ミットヨの登録商標または商標です。 また、その他の会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標である場合があります。
- ●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容をとは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。 ●本カタログに掲載されている仕様は2025年4月現在のものです。

お求めは当店で―